## ⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

#### ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-77809

®Int. Cl. <sup>5</sup>

識別記号

庁内整理番号

④公開 平成2年(1990)3月16日

G 05 D 16/00 H 01 L 21/027 Α 8209-5H

> 7376-5F H 01 L 21/30

3 3 1 Α

審査請求 未請求 請求項の数 6 (全4頁)

69発明の名称 圧力制御装置

> 20特 願 昭63-228388

22出 顋 昭63(1988) 9月14日

明者 @発 英 悟 Ш 上 個発 明 者 田 中 裕 ⑫発 明 者 字 田 個発 明 者 収 谷 卓 夫 @発 明 者 下  $\mathbf{\Xi}$ 勇 @発 明者 鵜 澤 俊 キヤノン株式会社 砂出 願人 哲也 弁理士 伊東 個代 理 人

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

外1名

### 1. 発明の名称

圧力制御装置

## 2. 特許請求の範囲

(1) 気体供給源から気体が供給されるガスチャ ンバー内の圧力を制御する圧力制御装置であって, 主ガスチャンバーと、該主ガスチャンパーに個別 の仕切り弁および差圧ゲージを介して連結された 少なくとも一つの副ガスチャンパーと、前記主ガ スチャンパー内の圧力を測定し所定圧力に制御す る圧力制御手段と、前記差圧ゲージの出力によっ て前記仕切り弁の開閉制御を行う仕切り弁制御手 段とを具備したことを特徴とする圧力制御装置。

(2) 前記気体はヘリウムガスであり、主ガスチ ャンバーはX線露光装置用のチャンバーであるこ とを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の圧力 制御装置。

(3) 前記割ガスチャンパーの一つは主ガスチャ ンバーに対して、ウェハの供給または回収を行う ウェハ搬送系のチャンパーであることを特徴とす

- 1 -

る特許請求の範囲第2項記載の圧力制御装置。

(4) 副ガスチャンパーの一つは主ガスチャンパ ーに対して、マスクの供給または回収を行うマス ク機送系のチャンパーであることを特徴とする特 許請求の範囲第2項記載の圧力制御装置。

(5) 前記主ガスチャンバーおよび養養の即ガス チャンパーは個別の大気リーク弁を有し、該主ガ スチャンバーおよび機数の関ガスチャンバーに対 する窒素ガス供給手段を備えたことを特徴とする 特許請求の範囲第1項記載の圧力制御装置。

(6) 前記主ガスチャンパーおよび副ガスチャン パーを真空排気するための真空排気手段を具備し たことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の 圧力制御装置。

## 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、真空または減圧雰囲気で使用される 圧力容器 (チャンパー) の圧力制御装置に関し、 特に半導体製造装置のチャンパーに適した圧力制 御装置に関するものである。

#### (従来の技術)

従来、真空または波圧雰囲気で使用される半導体 製造装置のチャンパーは、ウェハの露光などの処 理を行う主チャンパーに対して、ウェハの供給や 回収を行う搬送系を副チャンパーとして分離して 構成している。これは、ウェハを収納したキャリ ヤの交換時に副チャンパーのみをエアリークさせ て、全てのチャンパーを大気状態に開放する手間 を省くためである。主チャンパーと馴チャンパー の間はゲート弁(ロードロックバルブ)と呼ばれ る仕切り弁を介して連結されているが、副チャン パーを大気状態に開放する際はこれを閉め切って しまう。逆に、副チャンバーを真空または減圧雰 囲気にする場合は副チャンパーを真空排気して、 2 つのチャンパーの圧力が等しくなったところで ゲート弁を開いている。このとき,各チャンパー の絶対圧力を大気圧から高真空まで高精度に測定 する必要がある。従来は各チャンバーの圧力の検 出をそれぞれのチャンバーに取付けられた圧力ゲ ージを使用して行っていた。

- 3 -

主チャンパーは絶対圧に基づいて制御され、劇 チャンパーは主チャンパーとの差圧に基づいて制 御される。

### (実施例)

30はヘリウムガス供給源であり、 主チャンパ

(発明が解決しようとする課題)

前記従来技術においては、高価な絶対圧ゲージがチャンパーの数だけ必要になり、システム全体のコストが高くなるという問題があった。

本発明は上記従来技術の問題点に鑑みなされたものであって、高価な絶対圧ゲージを用いることなく高精度にチャンバー圧力を測定し制御可能な圧力制御装置の提供を目的とする。

#### 〔課題を解決するための手段〕

前記目的を達成するため、本発明では、気体供給源から気体が供給されるガスチャンバー内の圧力を制御する圧力制御装置であって、主ガスチャンパーと、該主ガスチャンパーに個別の仕切り弁および差圧ゲージを介して連結された少なチャンパー内の圧力を測定し所定圧力に制御する圧力制御手段と、前記差圧ゲージの出力によって前記仕切り弁の開閉制御を行う仕切り弁制御手段とを具備している。

(作用)

- 4 -

- C 0 に対してはガス流量制御装置FCを通して、副チャンパーC1、C2に対してはそれぞれへリウム供給パルブHV1、HV2を通して接続される。 4 0 は窒素ガス供給液であり、主チャンパーC0および副チャンパーC1、C2に対してそれぞれ窒素供給パルブNV0およびNV1、NV2を通して接続される。

10は圧力制御回路であり、主チャンバーC 0 に取付けられた絶対圧ゲージ G 0 によって検出した主チャンバーの圧力が所定の圧力となるように、流量制御装置 F C に指令を与えてへりウムガスの流量を制御する。これらの絶対圧ゲージ G 0 、流量制御装置 F C および圧力制御回路 1 0 で圧力制御手段を構成する。20は仕切り弁制御手段であるゲート弁制御装置で、各副チャンバーの差圧ゲージの出力によってそれぞれのゲート弁開閉のタイミングを制御する。

TMPはターボ分子ポンプ、RPはロータリーボンプで直列にして、主チャンバーC0 および劇チャンパーC1、C2に対してそれぞれ排気バル

ブ X V O および X V 1. X V 2 を通して接続され、 チャンパー内のガスを真空俳気する。 L V 0. L V 1. L V 2 は各チャンパーを大気開放するため のエアリークパルブである。

上記構成の圧力制御装置の動作について以下に 説明する。まず、未処理のウェハが収納されたキ ャリヤを大気開放されたウェハ搬送系の副チャン パーC1に設置する場合について説明すると、ゲ ート弁GV1は閉状態で、刷チャンパーC1は主 チャンバーC0から分離されている。また、排気 バルプ X V 1 . エアリークバルプ L V 1 およびへ リウム供給バルブHV1は閉じられているが、窒 素供給バルブNV1は開状態で、副チャンバーの 扉を開けても外気が入りにくい状態となっている。 一方、主チャンバーCOでは、排気パルプXV 0 が開けられ、2 つのポンプTMP、RPによっ て真空排気されながら、絶対圧ゲージG0で検出 される圧力がX線露光時の所定の圧力(例えば、 150 torr) となるように圧力制御回路 10 によ って流量制御装置FCに指令が出され、ヘリウム

- 7 -

れて、ゲート弁制御装置20によってゲート弁GV1が開けられる。以後、副チャンバーC1の圧力はゲート弁GV1を通して主チャンバーC0と一体で制御される。

次に、処理済みのウェハが収納されたキャリヤを副チャンパーC1から取り出す場合について説明する。まず、ウェハ酸送用のハンドなどがゲート弁GV1をまたいでいないことを確認して、ゲート弁制御装置20によってゲート弁GV1が開けられる。そして、窒素供給パルブNV1が開けられ、差圧ゲージG1によって排気パルブXV1が開けられ、ウェハキャリヤが取り出される。このが開けられ、ウェハキャリヤが取り出される。このが開けられ、ウェハキャリヤが取り出さなが、大気圧よりやや高い圧力まで発展がある。このが容易になる。

なお, マスクを収納したカセットを副チャンバ 一C2に設置したり, 取り出したりする場合も同 ガスの流量が制御されている。窒素供給バルブN V O . エアリークバルブ L V O は閉じられている。

また、マスク機送用の副チャンバーC2については、主チャンバーC0に対してマスクを搬入できるように、ゲート弁GV2は開状態になっている。従って、ヘリウム供給バルブHV2は閉じられていて、開状態の排気バルブXV2を通してポンプで排気することで主チャンバーC0と一体で前述のように圧力制御される。なお、エアリークバルブLV2と窒素供給バルブNV2は閉じられている。

以上の状態で副チャンパーC1内にウェハキャリヤが設置されチャンパーの扉が閉じられると、まず窒素供給パルブNV1が閉じられ、排気パルブXV1が開けられて窒素ガスが排気される。そして、差圧ゲージG1によって検出される圧力が高真空(例えば、0.001torr)になったところでへリウム供給パルブHV1が開けられる。次に、差圧ゲージG1によって検出される圧力が零になったところで、ヘリウム供給パルブHV1が閉じら

**- 8** -

様の手順で行われる。

### (発明の効果)

以上説明したように、本発明においては、主チャンパーに対して仕切り弁を介して連結された複数の副チャンパーを有する圧力制御装置において、主チャンパーを絶対圧で、各副チャンパーをその 差圧で圧力制御することにより、高価な絶対圧センサーを多数用いる必要がなくなり、安価な差圧センサーで絶対圧センサーと同精度の圧力制御が可能となり装置全体のコスト低減が図られる。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明に係わる圧力制御装置の構成図である。

10 · · · 圧力制御回路,

20・・・ゲート弁制御装置,

30・・・ヘリウムガス供給源,

40・・・ 窒素ガス供給源。

C0・・・主チャンパー。

C1、C2・・・ 刷チャンバー,

FC・・・ガス流量制御装置。

G0・・・絶対圧ゲージ。

G1、C2・・・差圧ゲージ。

G V 1, G V 2 · · · ゲート弁.

HV1、HV2・・・ヘリウム供給パルブ.

LVO,LV1.LV2 ・・・エアリークパルプ.

NVO,NVI,NV2 ・・・窒素供給パルプ,

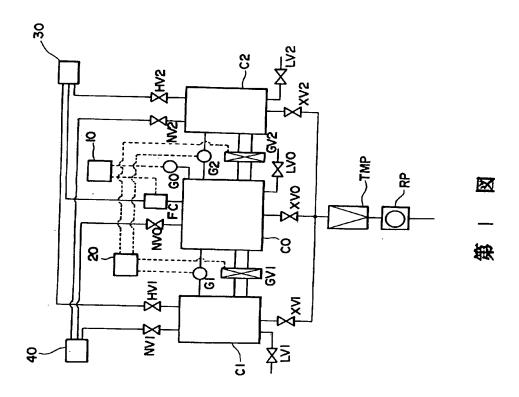
XVO,XV1,XV2 · · · 排気パルプ。

TMP・・・ターポ分子ポンプ,

RP・・・ロータリーポンプ。

特許出願人 キヤノン株式会社 代理人 弁理士 伊東哲也 代理人 弁理士 伊東辰雄

- I I -



# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-077809

(43) Date of publication of application: 16.03.1990

(51)Int.CI.

G05D 16/00 H01L 21/027

(21)Application number : 63-228388

(71)Applicant: CANON INC

(22)Date of filing:

14.09.1988

(72)Inventor: KAWAKAMI EIGO

TANAKA YUTAKA

**UDA KOJI** 

KARIYA TAKUO SHIMODA ISAMU

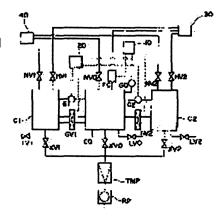
**UZAWA SHUNICHI** 

# (54) PRESSURE CONTROLLER

## (57)Abstract:

PURPOSE: To measure and control chamber pressure with high accuracy without using any expensive absolute pressure gauge by controlling a main chamber according to absolute pressure and a subordinate chamber according to the pressure difference from the main chamber.

CONSTITUTION: This controller is equipped with the main gas chamber CO, at least one of subordinate gas chambers C1 and C2 linked with the main gas chamber CO through individual partition valves GV1 and GV2 and differential gauges G1 and G2, a pressure control means 10 which measures the pressure in the main gas chamber CO and controls the pressure to specific pressure, and a partition valve control means 20 which



controls the opening and closing of the partition valves GV1 and GV2. Then the main chamber CO is controlled according to the absolute pressure and the subordinate chambers C1 and C2 are controlled according to the differential pressure. Consequently, the need to use many expensive absolute pressure sensors is eliminated and high-accuracy pressure

control is carried out.

## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office